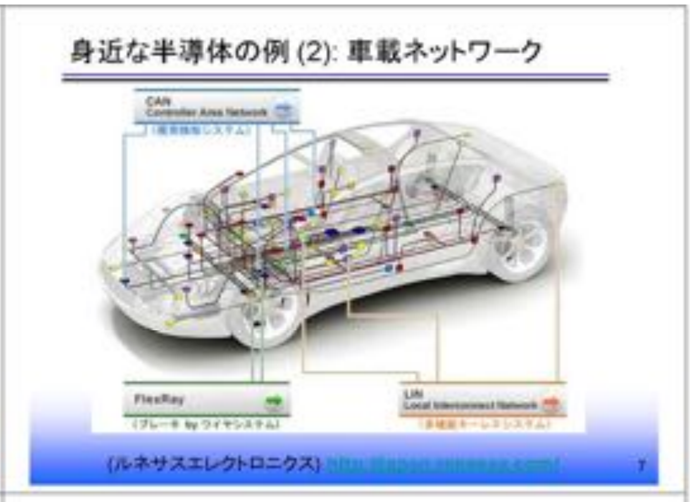
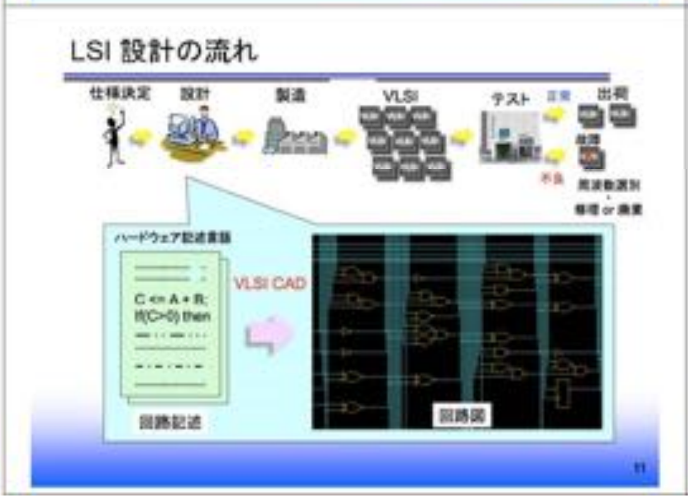
研究タイトル：LSI-CAD（LSI のテスト，テスト容易化設計，高位合成，論理合成）

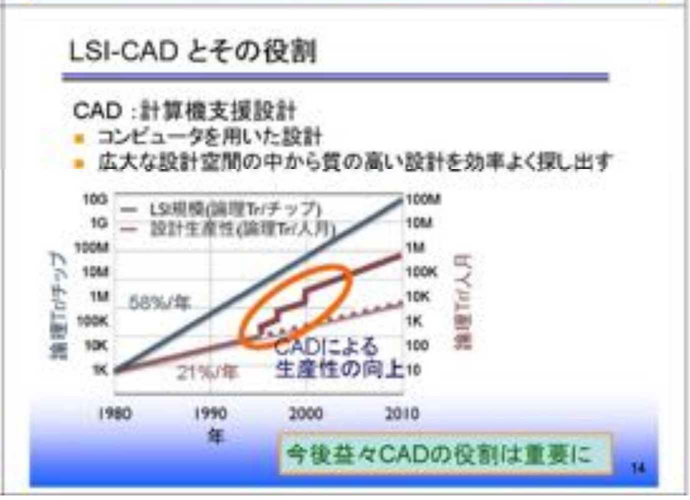
氏名：	吉川　祐樹　／　Yuki Yoshikawa	E-mail：	yosikawa@kure-nct.ac.jp
職名：	准教授	学位：	博士（工学）

所属学会・協会：	電子情報通信学会，IEEE
キーワード：	LSI のテスト，テスト容易化設計
技術相談 提供可能技術：	・高信頼 LSI 設計のための遅延故障のテスト技術 ・遅延故障のためのテスト容易化設計技術 ・高位レベルからのテスト容易性を考慮した設計技術

研究内容：LSI-CAD（LSI のテスト，テスト容易化設計）に関する研究







提供可能な設備・機器：

名称・型番（メーカー）	